

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination LOWE, MARK JEFFREY	
10/824,791		
Examiner	Art Unit	
Chuck Mah	3677	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
16	335 336 780× 285 286			
	280x			
	285	_		
	286	8/4/05	m	
-				

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		

(INCLUDING SEAR	CH STRATEG	<u>()</u>
	DATE	EXMR
		1
·		
		į.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		